

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-326381

(43)Date of publication of application : 26.11.1999

(51)Int.Cl.

G01R 1/073

H01L 21/66

(21)Application number : 10-156692

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 20.05.1998

(72)Inventor : INO SHINJI

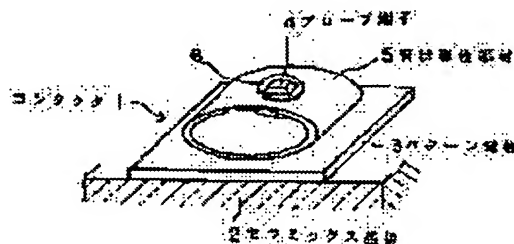
YAMASAKA CHIKAHITO

(54) CONTACTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a contactor with excellent contacting ability which achieves a simple support structure of a probe terminal and moreover, an absorption of difference in height of electrodes.

SOLUTION: This contactor 1 is provided with a pattern electrode 3 formed on the surface of a ceramics substrate 2 and a bump-shaped probe terminal 4 provided on the surface of the pattern electrode 3. An electroconductive tubular elastic member 5 is interposed between the probe terminal 4 and the pattern electrode 3. In this case, the probe terminal 4 has a flat contact surface at the tip thereof while being preferably formed as bump gradually tapered toward the tip thereof from the base end part thereof.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 28.05.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The contactor which is a contactor used in case it has the pattern electrode formed on the surface of the substrate, and the probe terminal of the shape of a bump prepared in the front face of this pattern electrode and electrical-characteristics inspection of an inspected object is conducted, and is characterized by making a conductive tubular elastic member intervene between the above-mentioned probe terminal and a pattern electrode.

[Claim 2] The above-mentioned probe terminal is a contactor according to claim 1 which has the flat contact surface at a tip, and is characterized by being formed as a bump who becomes thin gradually toward a tip from the end face section.

[Claim 3] The contactor according to claim 1 or 2 characterized by fabricating the above-mentioned substrate with the ceramics.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the contactor which can be used suitable for inspection of KGD (Known Good Die) in more detail about the contactor used in case electrical-characteristics inspection of an inspected object is conducted.

[0002]

[Description of the Prior Art] When carrying out electrical-characteristics inspection of IC chip formed in the inspected object (a "wafer" is only called hereafter.), for example, a semi-conductor wafer, a probe card is used as a contactor. [much] The probe card has played the role which relays transfer of a checking signal to a circuit tester between IC chips, when the pad for electrodes of a wafer is contacted at the time of inspection.

[0003] By the way, the degree of integration of IC chip increases rapidly, and the array of an electrode pad has formed the ** pitch increasingly recently. There are the probe card and membrane probe card which have the perpendicular needle shown in drawing 3 as a probe card corresponding to the formation of a ** pitch. The former probe card is the structure where two or more probe needles 11 were perpendicularly supported in the vertical direction by the through tubes 12A, 13A, and 14A of the guide plates 12, 13, and 14 of three sheets each

other arranged in parallel, as shown in this drawing. Moreover, as for the latter membrane probe card, many bump terminals are arranged by the membrane.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the case of the probe card conventional perpendicular needle type, as shown in drawing 3, in order to support the perpendicular needle 11, two or more guide plates were required, and there was a technical problem that the supporting structure of the perpendicular needle 11 was complicated in it. Moreover, flip chip mounting technology is developed by advance of the mounting technology of IC chip, and dealings of the bare chip whose quality was guaranteed, i.e., KGD, are being conducted in recent years. And KGD by which the solder bump was formed in the electrode pad in preparation for flip chip mounting may be supplied. In this case, although a bare chip will inspect in the condition that there is a solder bump for QA, and a solder bump's difference of elevation was absorbable with the probe card conventional perpendicular needle type on this occasion, the technical problem occurred in respect of contact that it is easy to wound a solder bump at the needle point of a perpendicular needle. Moreover, in the case of the bump terminal type probe card, a solder bump's difference of elevation could not be well absorbed with the bump terminal itself, but the technical problem was in contact by the solder bump.

[0005] It was made in order that this invention might solve the above-mentioned technical problem, and the supporting structure of a probe terminal is easy and it aims at offering the contactor excellent in the contact nature which can moreover absorb the difference of elevation of an electrode.

[0006]

[Means for Solving the Problem] The contactor of this invention according to claim 1 is a contactor used in case it has the pattern electrode formed on the surface of the substrate, and the probe terminal of the shape of a bump prepared in the front face of this pattern electrode and electrical-characteristics inspection of an inspected object is conducted, and is characterized by making a conductive tubular elastic member intervene between the above-mentioned probe terminal and a pattern electrode.

[0007] Moreover, in invention according to claim 1, the above-mentioned probe terminal has the flat contact surface at a tip, and the contactor of this invention according to claim 2 is characterized by being formed as a bump who becomes thin gradually toward a tip from the end face section.

[0008] Moreover, the contactor of this invention according to claim 3 is characterized by fabricating the above-mentioned substrate with the ceramics in invention according to claim 1 or 2.

[0009] Hereafter, this invention is explained based on the operation gestalt shown in (a) of drawing 1, (b), and drawing 2. The contactor 1 of this operation gestalt For example, the ceramic substrate 2 with which the laminating of the internal circuit pattern of two or more layers was carried out as shown in drawing 1 and drawing 2, The pattern electrode 3 of the shape of two or more square arranged in the shape of a matrix on the front face of this ceramic substrate 2, It has the probe terminal 4 of the shape of a bump arranged on this pattern electrode 3, respectively, the number of the probe terminals 4 is set up if needed, and two or more chips can be inspected now to coincidence. And between the probe terminal 4 and the pattern electrode 3, the tubular elastic member 5 which consists of a conductive metal intervened, and while this tubular elastic member 5 bases and carries out elastic deformation to the stylus pressure at the time of inspection, between the probe terminals 4 is electrically connected with the pattern electrode 3.

[0010] The above-mentioned tubular elastic member 5 is formed in the magnitude 2-3 micrometers and whose die length 100-150 micrometers and thickness are 100-150 micrometers for an outer diameter with conductive metals, such as for example, a beryllium-copper alloy and copper. The flat-surface configuration is presenting the shape of an abbreviation square like [it is ***** and] also from drawing 2. And the thickness of the tubular elastic member 5 has adjusted the stylus pressure at the time of inspection suitably. Joining of this tubular elastic member 5 is carried out to the front face of the pattern electrode 3. Moreover, the plating section 6 which consists of conductive metals, such as a beryllium-copper alloy and a nickel-gold alloy, is formed in the center of the upper limit section of the tubular elastic member 5, and the probe terminal 4 is formed in this plating section 6. Although this probe terminal 4 is formed in the core of the tubular elastic member 5 as shown in drawing 2, according to arrangement of the electrode pad of a chip, the probe terminal 4 can be suitably deflected from the core of the tubular elastic member 5, and can also be prepared.

[0011] As shown in drawing 1, the bump probe terminal 4 of the above becomes thin gradually over the end face section to a point, and is formed in the shape of [which moreover has a square flat side mostly at the tip] a square frustum. Although not illustrated, the probe terminal 4 consists of the core section formed in the shape of a square frustum with ores, such as an ingredient with a degree of hardness higher than an electrode pad, for

example, a diamond, sapphire, and a quartz, and electric conduction film in which coating was carried out to the external surface by good conductive metals, such as gold, rhodiums, or these alloys. And it connects with the plating section 6 and the end face section of the electric conduction film is aiming at the flow with the electrode pad of a chip through the electric conduction film. The height from pattern electrode 3 front face is formed in 50–100 micrometers, and the side length of the flat side at the tip is formed in 5–200 micrometers for the probe terminal 4. When it is difficult for the side length of a flat side to secure enough the contact resistance of the peripheral surface of the probe terminal 4, and an electrode pad although the probe terminal 4 eats away in an electrode pad in less than 5 micrometers and it exceeds 200 micrometers, there is a possibility that interlocking over an electrode pad may become difficult. The bump-like probe terminal 4 can be formed by applying process techniques, such as chemical vapor deposition. Moreover, the probe terminal 4 may be formed not only in the shape of a square frustum but in a truncated-cone configuration.

[0012] Next, actuation is explained, referring to drawing 3. After laying the carrier (not shown) with which two or more bare chips T were contained on an installation base (not shown) movable in X, Y, Z, and the direction of theta of probe equipment, an installation base moves to just under the contactor 1 with which probe equipment was equipped. Subsequently, a rise of an installation base contacts the solder bump B for the probe terminal 4. Furthermore, if an installation base carries out an exaggerated drive, stylus pressure will act on the probe terminal 4. Under the present circumstances, even if there is the difference of elevation among the solder bumps B of the plurality of a bare chip T, according to each solder bump's B height, the tubular elastic member 6 carries out elastic deformation to the condition shown as a continuous line from the condition shown with the alternate long and short dash line of drawing 3 R> 3, and the difference of elevation between each solder bump B is absorbed, and each probe terminal 4 eats away certainly in each solder bump B, and it can contact certainly, and changes into the condition that it can flow through between a circuit tester and a bare chip T. If a predetermined checking signal is transmitted from a circuit tester in this condition, a bare chip T will receive a checking signal through the pattern electrode 3 and the probe terminal 4, a reverse path is followed and an inspection result signal is transmitted to a circuit tester. Then, if a carrier descends and the solder bump B separates from the probe terminal 4, the probe terminal 4 will end inspection of return and a bare chip T to the condition shown with the original alternate long and short dash line from the condition shown as the continuous line of drawing 3, will carry out indexing of the bare chip T, and will move to inspection of the following bare chip T.

[0013] In case the probe terminal 1 eats into the solder bump B, shearing force acts from the edge around [a flat side] the tip of the probe terminal 4 to the solder bump B, the solder bump's B front face is cut with an edge, and the probe terminal 4 begins to eat into the solder bump B. By rise of the subsequent bare chip T, it eats away gradually, extending the solder bump B to a perimeter by the peripheral surface of the probe terminal 4, and a good flow with the solder bump B is secured. If it inspects in this condition, transfer of a signal can be ensured between the probe terminal 4 and the solder bump B, and reliable inspection can be conducted.

[0014] The pattern electrode 3 which was formed in the front face of the ceramic substrate 2 according to this operation gestalt as explained above, It has the probe terminal 4 of the shape of a bump prepared in the front face of this pattern electrode 3. Are the contactor 1 used in case electrical-characteristics inspection of a bare chip T is conducted, and since the conductive tubular elastic member 5 was made to intervene between the probe terminal 4 and the pattern electrode 3, the supporting structure of the probe terminal 4 is easy. And the solder bump's B difference of elevation can be absorbed, and it can contact certainly to the solder bump B. According to this operation gestalt, since the probe terminal 4 is connected to the ceramic substrate 1 through wiring structure, electric resistance is small excellent in a RF property, and, moreover, can ensure high-speed inspection. Moreover, since the probe terminal 4 is formed in the shape of a bump, it can respond satisfactory at all also to the bare chip T formed into the ** pitch, and moreover, it can be based on the array of the electrode pad P of a bare chip T, the probe terminal 4 can be arranged, and the array degree of freedom can be raised. Moreover, since it formed as a square frustum-like bump, the above-mentioned probe terminal 4 gives shearing force from the edge around [a flat side] a tip to the solder bump B, into the solder bump B, can eat away certainly and can raise contact nature with the solder bump B further.

[0015] It is necessary to take out to a commercial scene as KGD, and when trading with a bare chip T especially, where the solder bump B is moreover formed in an electrode pad in preparation for flip chip mounting, it may take out to a commercial scene. In such a case, if the contactor 1 of this operation gestalt is used, contact for the solder bump B and the probe terminal 4 is good, and since [which spoils the solder bump B] there is nothing things, it can use suitably as a contactor for KGD. And when supplying KGD in the state of a wafer, it is

also easy to make the contactor which inspects two or more chips in the wafer condition to coincidence.
[0016] In addition, although the above-mentioned operation gestalt explained the case where contacted the solder bump B and the probe terminal 4 was inspected, it can inspect similarly about the case where electrode pads, such as aluminum, are made to contact. Moreover, [0017]
[Effect of the Invention] According to invention of this invention according to claim 1 to 3, the supporting structure of a probe terminal is easy and can offer the contactor excellent in the contact nature which can moreover absorb the difference of elevation of an electrode.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the perspective view expanding and showing the important section of the contactor of this invention.

[Drawing 2] It is the top view showing a part of contactor shown in drawing 1 .

[Drawing 3] It is the explanatory view of the probe terminal of a contactor shown in drawing 1 of operation.

[Drawing 4] It is the sectional view of a lengthwise direction showing the important section of a probe card conventional perpendicular needle type.

[Description of Notations]

- 1 Contactor
- 2 Ceramic Substrate
- 3 Pattern Electrode
- 4 Probe Terminal
- 5 Tubular Elastic Member
- T Bare chip
- B Solder bump

[Translation done.]

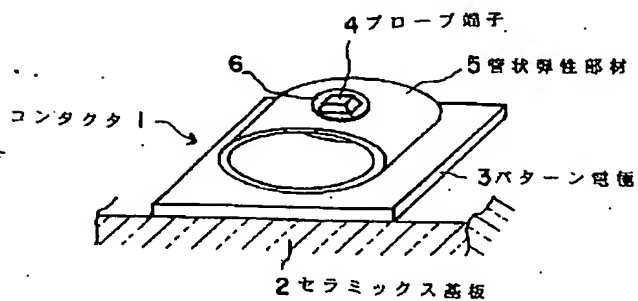
* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

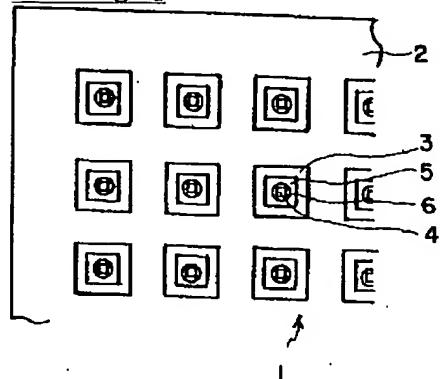
- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

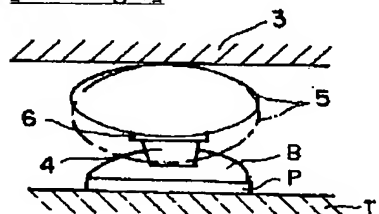
[Drawing 1]



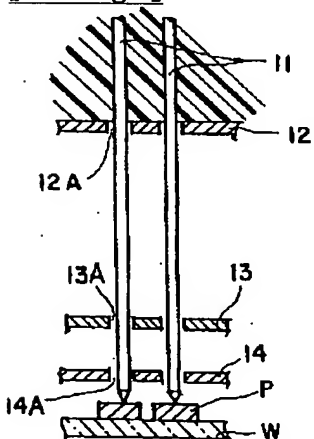
[Drawing 2]



[Drawing 3]



[Drawing 4]



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-326381

(43) 公開日 平成11年(1999)11月28日

(51) Int. Cl.⁵

識別記号

FI

G 0 1 R 1/073

G 0 1 R 1/073

F

H 0 1 L 21/66

H 0 1 L 21/66

B

審査請求 未請求 請求項の数 3 FD (全 4 頁)

(21) 出願番号 特開平10-156622

(22) 出願日 平成10年(1998) 5月20日

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目8番8号

(72) 発明者 飯野 伸治

山梨県基町市黒井町北下条2381番地の1

東京エレクトロン山梨株式会社内

(72) 発明者 山坂 カ仁

山梨県基町市黒井町北下条2381番地の1

東京エレクトロン山梨株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小原 肇

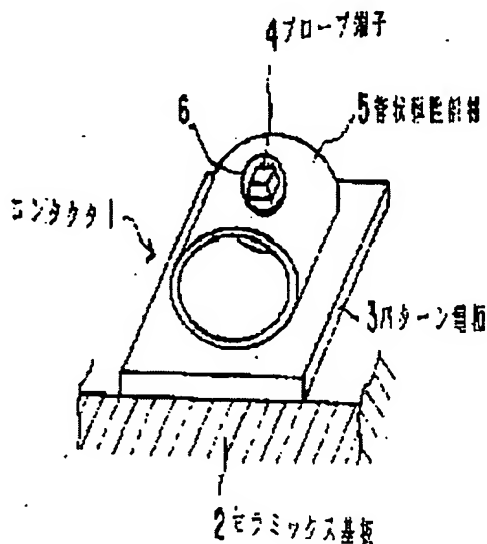
(54) 【発明の名称】 コンタクタ

(57) 【要約】

【課題】 従来の垂直針タイプのプロープカードの場合には、図4に示すように垂直針11を支持するために複数の案内板12、13、14が必要で、垂直針11の支持構造が複雑である。また、従来の垂直針タイプ、メンブレンプロープカードも半田バンプが設けられた電極パッドの高低差を十分に吸収できない。

【解決手段】 本発明のコンタクタ1は、セラミックス基板2の表面に形成されたパターン電極3と、このパタ

ーン電極3の表面に設けられたバンプ状のプロープ端子4とを備え、プロープ端子4とパターン電極3との間に導電性の管状弾性部材5を介在させたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板の表面に形成されたパターン電極と、このパターン電極の表面に設けられたバンプ状のフロープ端子とを備え、被検査体の電気的特性検査を行う際に用いられるコンタクタであって、上記フロープ端子とパターン電極との間に導電性の管状弾性部材を介在させたことを特徴とするコンタクタ。

【請求項 2】 上記フロープ端子は、先端に平坦な接触面を有し、且つ、その基端部から先端に向かって徐々に細くなるバンプとして形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のコンタクタ。

【請求項 3】 上記基板がセラミックスにより成形されていることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のコンタクタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、被検査体の電気的特性検査を行う際に用いられるコンタクタに関し、更に詳しくは、KGD (Known Good Die) の検査に好適に用いることができるコンタクタに関する。

【0002】

【従来の技術】 被検査体、例えば半導体ウエハ（以下、単に「ウエハ」と称す。）に多数形成された IC チップの電気的特性検査をする場合にはコンタクタとしてフロープカードが用いられる。フロープカードは検査時にウエハの電極用パッドと接触した時にテストと IC チップ間で検査用信号の授受を中継する役割を果たしている。

【0003】 ところで最近、IC チップの集積度が急激に高まり、電極パッドの配列が益々狭ピッチ化している。狭ピッチ化に対応したフロープカードとして例えば図 3 に示した垂直針を有するフロープカードやメンブレンフロープカードがある。前者のフロープカードは、同図に示すように、複数のフロープ針 11 が上下方向に互いに平行に配置された 3 枚の案内板 12、13、14 の貫通孔 12A、13A、14A で垂直に支持された構造である。また、後者のメンブレンフロープカードはメンブレンに多数のバンプ端子が配列されたものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来の垂直針タイプのフロープカードの場合には、図 3 に示すように垂直針 11 を支持するために複数の案内板が必要で、垂直針 11 の支持構造が複雑であるという課題があった。また、近年、IC チップの実装技術の進歩によりフリップチップ実装技術が開発され、品質保証されたベアチップ、即ち KGD の取り引きが行われつつある。しかも、フリップチップ実装に備えて電極パッドに半田バンプの形成された KGD が供給されることがある。この場合には品質保証のために半田バンプのある状態でベアチップの検査することになるが、この際に従来の垂直針タイプのフロープカードでは半田バンプの高低差を吸収

することができるが、垂直針の針先で半田バンプを傷つけ易くコンタクト面で課題があった。また、バンプ端子タイプのフロープカードの場合にはバンプ端子自体で半田バンプの高低差をうまく吸収できず、半田バンプとのコンタクトに課題があった。

【0005】 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、フロープ端子の支持構造が簡単で、しかも電極の高低差を吸収することができるコンタクト性に優れたコンタクタを提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明の請求項 1 に記載のコンタクタは、基板の表面に形成されたパターン電極と、このパターン電極の表面に設けられたバンプ状のフロープ端子とを備え、被検査体の電気的特性検査を行う際に用いられるコンタクタであって、上記フロープ端子とパターン電極との間に導電性の管状弾性部材を介在させたことを特徴とするものである。

【0007】 また、本発明の請求項 2 に記載のコンタクタは、請求項 1 に記載の発明において、上記フロープ端子は、先端に平坦な接触面を有し、且つ、その基端部から先端に向かって徐々に細くなるバンプとして形成されていることを特徴とするものである。

【0008】 また、本発明の請求項 3 に記載のコンタクタは、請求項 1 または請求項 2 に記載の発明において、上記基板がセラミックスにより成形されていることを特徴とするものである。

【0009】 以下、図 1 の (a)、(b) 及び図 2 に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。本実施形態のコンタクタ 1 は、例えば図 1、図 2 に示すように、複数の内部配線パターンが積層されたセラミックス基板 2 と、このセラミックス基板 2 の表面にマトリックス状に配列された複数の正方形形状のパターン電極 3 と、このパターン電極 3 上にそれぞれ配設されたバンプ状のフロープ端子 4 とを備え、必要に応じてフロープ端子 4 の数を設定し、複数のチップを同時に検査できるようになっている。そして、フロープ端子 4 とパターン電極 3 との間には導電性金属からなる管状弾性部材 5 が介在し、この管状弾性部材 5 が検査時の針圧に即して弾性変形すると共にパターン電極 3 とフロープ端子 4 間を電気的に接続している。

【0010】 上記管状弾性部材 5 は、例えばベリリウム-銅合金、銅等の導電性金属によって外径が 100~150 μm 、肉厚が 2~3 μm 、長さが 100~150 μm の大きさに形成されている。その平面形状は図 2 から明かなように略正方形を呈している。そして、管状弾性部材 5 の肉厚によって検査時の針圧を適宜調整するようにしてある。この管状弾性部材 5 はパターン電極 3 の表面に溶着されている。また、管状弾性部材 5 の上端部中央にはベリリウム-銅合金、ニッケル-金合金等の導電性金属からなるメッキ部 6 が形成され、このメッキ

部6にプローブ端子4が設けられている。このプローブ端子4は図2に示すように管状弾性部材5の中心に設けられているが、チップの電極パッドの配置に応じてプローブ端子4を管状弾性部材5の中心から適宜偏倚させて設けることもできる。

【0011】上記パンパ状のプローブ端子4は、例えば図1に示すように、基端部から先端部に達して徐々に細くなり、しかもその先端にはほぼ正方形の平坦面を有する、四角錐台状に形成されている。図示していないが、プローブ端子4は、電極パッドより硬度の高い材料、例えばダイヤモンド、サファイヤ、石英等の鉱石によって四角錐台状に形成されたコア部と、その外面に例えば金、ロジウムあるいはこれらの合金等の良導性金属によってコーティングされた導電膜とからなっている。そして、導電膜の基端部がメッキ部6と接続され、導電膜を介してチップの電極パッドとの導通を図っている。プローブ端子4はパターン電極3表面からの高さが例えば50～100 μm に形成され、その先端の平坦面の辺長は例えば5～200 μm に形成されている。平坦面の辺長が5 μm 未満ではプローブ端子4が電極パッド内に食い込んでもプローブ端子4の周面と電極パッドとの接触抵抗を十分確保することが難しく、200 μm を超えると電極パッドに対する食い込みが難しくなる虞がある。パンパ状のプローブ端子4は、例えば化学的气相成長法等のプロセス技術を適用することにより形成することができる。また、プローブ端子4は四角錐台状に限らず、円錐台形状に形成したものであっても良い。

【0012】次に、図3を参照しながら動作について説明する。複数のベアチップTが収容されたキャリア（図示せず）をプローブ装置のX、Y、Z及び θ 方向に移動可能な載置台（図示せず）上に載置した後、載置台がプローブ装置に装着されたコンタクト1の真下まで移動する。次いで、載置台が上昇すると半田パンパBがプローブ端子4と接触する。更に、載置台がオーバドライブするとプローブ端子4に針圧が作用する。この際、ベアチップTの複数の半田パンパB間で高低差があってもそれぞれの半田パンパBの高さに応じて管状弾性部材6が図3の一点鎖線で示す状態から実線で示す状態まで弾性変形して各半田パンパB間の高低差を吸収して各プローブ端子4がそれぞれの半田パンパB内に確実に食い込んで確実にコンタクトでき、テストとベアチップT間を導通できる状態にする。この状態でテストから所定の検査用信号を送信するとパターン電極3、プローブ端子4を介してベアチップTで検査用信号を受信し、検査結果信号を逆の経路を辿ってテストへ送信する。その後、キャリアが下降して半田パンパBがプローブ端子4から離れると、プローブ端子4は図3の実線で示す状態から元の一点鎖線で示す状態まで戻り、ベアチップTの検査を終了し、ベアチップTをインデックス送りして次のベアチップTの検査へと移る。

【0013】プローブ端子1が半田パンパBに食い込む際に、プローブ端子4の先端の平坦面周囲のエッジから半田パンパBに対してせん断力が作用し、半田パンパBの表面をエッジで切断し、プローブ端子4が半田パンパBに食い込み始める。その後のベアチップTの上昇で、プローブ端子4の周面で半田パンパBを周囲へ押し広げながら徐々に食い込み、半田パンパBとの良好な導通を確保する。この状態で検査を実施すれば、プローブ端子4と半田パンパBとの間で確実に信号の授受を行うことができ信頼性の高い検査を行うことができる。

【0014】以上説明したように本実施形態によれば、セラミックス基板2の表面に形成されたパターン電極3と、このパターン電極3の表面に設けられたパンパ状のプローブ端子4とを備え、ベアチップTの電気的特性検査を行う際に用いられるコンタクト1であって、プローブ端子4とパターン電極3との間に導電性の管状弾性部材5を介在させたため、プローブ端子4の支持構造が簡単で、しかも半田パンパBの高低差を吸収して半田パンパBに対して確実にコンタクトすることができる。また、本実施形態によれば、プローブ端子4を配線構造を介することなくセラミックス基板1に接続しているため、電気抵抗が小さく高周波特性に優れ、しかも高速検査を確実に行うことができる。また、プローブ端子4がパンパ状に形成されているため、狭ピッチ化したベアチップTに対しても何等問題なく対応することができ、しかもベアチップTの電極パッドPの配列に即してプローブ端子4を配列することができ、その配列自由度を高めることができる。また、上記プローブ端子4は四角錐台状のパンパとして形成したため、先端の平坦面周囲のエッジから半田パンパBに対してせん断力を付与して半田パンパB内に確実に食い込み、半田パンパBとのコンタクト性を更に高めることができる。

【0015】特に、ベアチップTで取り引きする場合、KGDとして市場に出す必要があり、しかもフリップチップ実装に備えて電極パッドに半田パンパBを設けた状態で市場に出すこともある。このような場合に本実施形態のコンタクト1を用いれば、半田パンパBとプローブ端子4とのコンタクトが良好で、半田パンパBを損なうことないため、KGD用のコンタクトとして好適に用いることができる。しかも、ウエハ状態でKGDを供給する場合には、ウエハ状態で複数のチップを同時に検査するコンタクトを作るのも容易である。

【0016】尚、上記実施形態では、プローブ端子4を半田パンパBにコンタクトさせて検査する場合について説明したが、アルミニウム等の電極パッドに接触させる場合についても同様に検査することができる。また、

【0017】

【発明の効果】 本発明の請求項1～請求項3に記載の発明によれば、プローブ端子の支持構造が簡単で、しかも電極の高低差を吸収することができるコンタクト性に優

れたコンタクタを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明のコンタクタの要部を拡大して示す斜視図である。

【図 2】 図 1 に示すコンタクタの一部を示す平面図である。

【図 3】 図 1 に示すコンタクタのプロープ端子の動作説明図である。

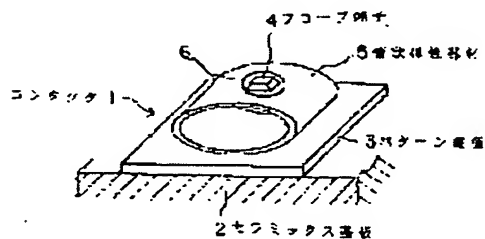
【図 4】 従来の垂直針タイプのプロープカードの要部を

示す縦方向の断面図である。

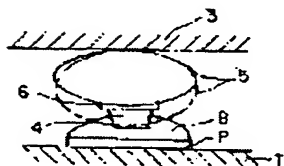
【符号の説明】

- 1 コンタクタ
- 2 セラミックス基板
- 3 パターン電極
- 4 プロープ端子
- 5 管状弾性部材
- T ペアチップ
- B 半田バンプ

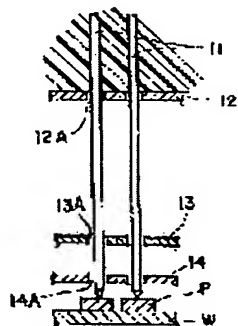
【図 1】



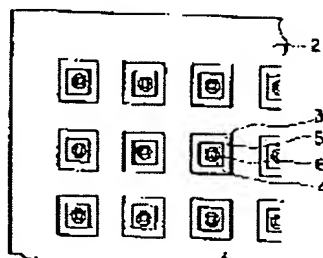
【図 3】



【図 4】



【図 2】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.